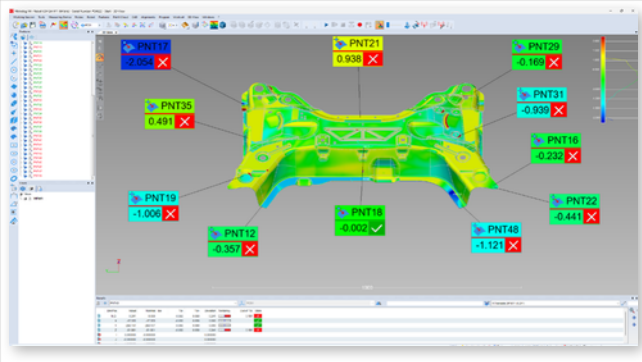
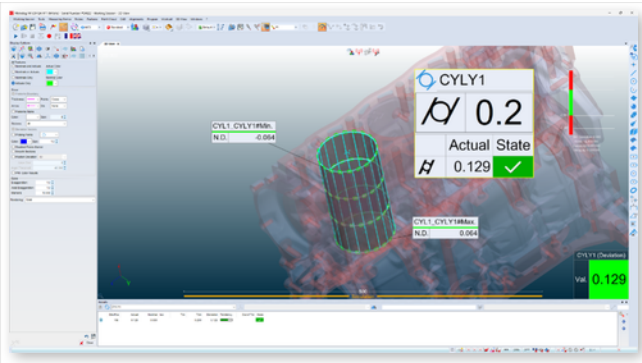




metrolog

重新定义您的 3D 测量标准

Metrolog 可为三坐标测量机 (CMM)、扫描仪、测量臂和转台提供高精度的结果、报告及分析。



通用兼容性：原生支持所有 3D 测量设备（三坐标测量机、激光跟踪仪、测量臂、3D 扫描仪、光学传感器等）。

凭借先进的算法和计算速度，优化整个测量流程。

自动执行控制、分析和报告，从而提高生产率。

100% 应对您挑战与项目的全面解决方案。

确保所采集 3D 测量数据的可靠性、重复性和高精度。

技术特点



无论设备品牌，均可通过软件直接连接。



高效导入、导出及处理来自大型 CAD 文件（IGES、STEP、CATIA、NX、SOLIDWORKS 等）或海量点云的大规模数据。



借助几何和尺寸公差引擎进行先进的几何公差分析 (GD&T)，实现符合 ANSI 和 ISO 标准的定义与评估，并获得 PTB 和 NIST 认证。



凭借优化的路径显示，清晰地实现轨迹可视化。



高性能点云分析：使用功能强大且全面的工具，轻松完成扫描、拟合、过滤、分析及提取数据。



生成定制化报告，创建带有图形和注释的实时交互式输出。



支持将报告导出为多种格式（PDF、Excel、Q-DAS 等），包括用于结果共享的 QIF 格式，从而促进分析与协作。



通过图形可视化实现实时计算，并支持基于统计分析的报告导出。



Metrologic Group China

上海市徐汇区天钥桥路329号，
嘉汇国际广场B幢822室，
邮编：200030 - 中国

电话：+86 150 0010 2351

Dimensional Control Systems, Inc.

North American Innovation Center
28064 Center Oaks Ct A, Wixom, MI 48393
+1 (248) 504 6200

了解 METROLOGIC DCS 如何转变您的
质量运营模式。



预约演示



我们的产品